# تغییر خواص ساختاری و نوری نانولایهٔ اکسید روی آلایش شده توسط منگنز با پارامترهای فیزیکی

محمد يونسى\*، مهرانه نعمتى

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل، ایران

دريافت: 1397/05/02 ويرايش نهايي: 1398/02/20 پذيرش: 1398/04/16

## چکیدہ

لایههای نازک اکسید روی خالص و آلایش یافته با ناخالصی منگنز بهروش سل-ژل برروی زیرلایههای شیشه تهیه شده و خواص فیزیکی آن در ضخامتها و دماهای بازیخت مختلف همراه با اثر لایهها بررسی شده است. با افزایش ضخامت، دمای بازیخت و افزایش لایهها طیف تراگسیل نمونهها در طول موجهای اندازه گیری شده کاهش می یابد. طیف XRD ساختار بلوری در دماهای بازیخت بالا شکل می گیرد و همچنین افزایش دمای بازیخت و لایهها موجب کاهش گاف انرژی نانو فیلمها می شود. این تغییرات بین 3/45 تا 3/84 الکترون ولت برای دمای بازیخت و بین 3/38 تا 3/11 الکترون ولت برای تغییرات لایه است. با افزایش ضخامت ثابتهای اپتیکی نانولایهها افزایش می یابند. افزایش دمای باز پخت و ضخامت نمونهها، باعث افزایش کیفیت بلوری می شود که در تابتهای اپتیکی نانولایه افزایش می یابند. افزایش دمای باز پخت و ضخامت نمونه ها، باعث افزایش کیفیت بلوری می شود که در تابتهای اپتیکی نانولایه افزایش می یابند. افزایش دمای باز پخت و ضخامت نمونه ها، باعث افزایش کیفیت بلوری می شود که در تابتهای اپتیکی نانولایه افزایش می یابند. افزایش دمای باز پخت و ضخامت نمونه ها، باعث افزایش کیفیت بلوری می شود که در تابتهای اپتیکی نانولایه ها فزایش می یابند. افزایش دمای باز پخت و ضخامت نمونه ها، باعث افزایش کیفیت بلوری می شود که در تابتهای اپتیکی نانولایه ها نوزایش می یابند. افزایش دمای باز گیزین گاف انرژی و کوچکترین اندازهٔ دانه را دارد. همچنین قرار گرفت. محاسبهٔ گاف نواری نمونه تهیه شده با حالل متانول بزرگترین گاف انرژی و کوچکترین اندازهٔ دانه را دارد. همچنین بالاترین درصد تراگسیل نیز متعلق به مین حالل می باشد.

**کلیدواژگان:** اکسید روی، سل-ژل، نانو لایه، آلایش، ضخامت، دما

#### مقدمه

اکسید روی دارای خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر بهفردی است از اینرو در صنعت کاربرد فراوان دارد. اکسید روی با انرژی گاف نواری 3/37ev [1] و انرژی همبستگی اکسیتونی 800mo، قابلیت رشد بر روی انواع زیرلایهها و شفافیت بالا در محدودهٔ نور مرئی را دارد. خواص پیزوالکتریک گزینه مناسبی برای کاربرد در ابزارهای اپتوالکترونیک و حسگرها می باشد. در فشار و دمای محدود اکسید روی به شکل ساختار بلوری ورتسایت می باشد. پارامتر شبکهٔ سلول واحد

باز نشر این مقاله با ذکر منبع آزاد است. این مقاله تحت مجوز کریتیو کامنز تخصیص 4,0 بینالمللی میاشد



اکسید روی برابر با 3=2/4953 و 5/2069 ت آنگستروم با چگالی 3-5/605 است [2]. اکسید روی علاوه بر فاز ورتسایت دارای ساختار زینک بلند و سنگ نمک (Na Cl) نیز می باشد. بر طبق محاسبات تئوری ممکن است فاز چهارمی با ساختار مکعبی سزیم در دماهای خیلی بالا وجود داشته باشد ولی در عمل تجربه نشده است [3]. ساختار نوار الکترونی نیم رسانای اکسید روی توسط گروههای زیادی محاسبه شده است [4و5]. حداقل نوار رسانش و حداکثر نوار ظرفیت در نقطهٔ گاما

<sup>\*</sup> نويسنده مسئول: myuonesi@gmail.com

با گاف نواری مستقیم است. نیمرساناها بهطور کلی غیر مغناطيسي هستند ولي با آلايش توسط فلزات واسطه خواص مغناطیسی از خود نشان میدهند. برای کاربرد نیمرسانا در ابزارهای اپتوالکترونیکی لازم است گاف نواری را با آلایشی از مواد دیگر تغییر داد. خواص فیزیکی اکسید روی بهروش های رشد و زیرلایه استفاده شده بستگی دارد. روش های زیادی برای رشد وجود دارد مانند: اسپاترینگ [6]، تبخیر حرارتی، اسپری پايروليزز [7] و سل–ژل[8]. سل–ژل روش منحصر بەفردى است كە مىتوان براي لايەنشانى سطوح بزرگ و با اشکال پیچیده از آن استفاده نمود. ارزان بودن این روش نیز مزیت دیگر آن است. نوع بلور ( فیلم نازک، پودر، سیم یا نقطهٔ کوآنتومی) و شرایط محیطی مانند دما، فشار، رطوبت و آلایش عواملی هستند که روی خصوصیات فیزیکی اکسید روی اثر می گذارند. در این بررسی، نانو فیلمهای اکسید روی آلایش یافته با منگنز بەروش سل-ژل بر روی زیرلایهٔ شیشهای تهیه شده و اثر عوامل محیطی شامل ضخامت، عملیات حرارتی و حلال روی خصوصیات فیزیکی آن مورد بررسی قرار گر فت.

مواد مصرفی برای روش سل-ژل عبارت است از: استات روی[ $_{2H_2O}_2 - 2H_{2^0}$ ] برای منبع روی، استات منگنز [ $Mn(CH_3Coo)_2 - 4H_2O$ ] برای منبع [ $C_3H_8O_2$ ] (DME) (DME) [ $C_3H_8O_2$ ] (DME) منگنز، مایع 2-میتا اکسیداتانول(MEA) برای پایداری حلال، مایع مونو اتانول آمین(MEA) استفاده شده است.

برای PH و ویسکوزیتهٔ محیط سلی به ترتیب از PH متر مدل Jenway, 35.5 و NDJ-1 استفاده شده است. برای بررسی ساختار نانو فیلم ها از دستگاه XRD مدل Philips 1840 استفاده شد. طیف تراگسیل فیلمها با استفاده از دستگاه طیف سنج مدل Cary 100 شرکت Varian بهدست آمده و ثوابت اپتیکی نانوفیلمها با

استفاده از رابطهٔ کوشی در لایههای نازک و تئوری چامبلیرون و همکاران محاسبه شده است [9].

## نقش گرما

برای تهیهٔ نانو فیلمهای ZnO:Mn بهروش سل-ژل، ابتدا در دمای اتاق، استات روی و منگنز را با نرخ اتمی که MEA و DME که  $\frac{[Mn]}{[Zn]}$  = 5% [MEA] = 1 است، حل می شود. محلول نهائی با  $\begin{bmatrix} MEA \\ I \end{bmatrix} = 1$ همزن مغناطیسی در دمای 70°C بهمدت یک ساعت هم زده می شود، که در نهایت یک محلول یکنواخت و شفاف حاصل می گردد. در دمای اتاق، بعد از 24 ساعت بەروش غوطه ورسازى عمل لايەگذارى صورت می گیرد. ابتدا زیرلایههای شیشهای در آب جوش همراه با مواد شوينده بهمدت نيمساعت جوشانده مي شوند و سپس با آب خوب شوسته شده و با الکل و استون در آلتراسونیک تمیز شده و سپس در جایگاه مربوطه بهصورت عمودی گذاشته و با سرعت یک میلیمتر بر ثانیه زیرلایه را از سل خارج کرده و بهمدت بیست دقیقه زیرلایهٔ لایهنشانی شده را در کوره در دمای اولیهٔ 200 °C حرارت میدهیم تا قسمتی از مواد آلی محلول در زيرلايه تبخير شوند تا عمل خشک سازي اوليه صورت گیرد، و عمل لایه گذاری را پنج بار تکرار میکنیم. در نهایت نانو فیلمهای تهیه شده را برای عملیات بازپخت نهائي در دماي 300، 400، 450 و 500 درجهٔ سلسيوس در کوره در هوای آزاد بهمدت یک و نیمساعت حرارت مىدهيم. نانو فيلمها براي انجام آزمايشهاي فيزيكي تا دمای اتاق بهطور طبیعی سرد می شوند. ضخامت لایه ها در حدود 200 نانومتر بهدست آمدهاست. PH متری محيطي نشان مي دهد كه محيط سلى تقريباً قليائي (7/5) با ويسكو زيتة 3/3 mPa.s است.

شكل 1 طيف XRD چهار نمونه Osofo می دهد. همهٔ نمونه م برحسب دمای بازیخت را نشان می دهد. همهٔ نمونه ها در دمای خشکسازی 2° 200 به مدت بیست دقیقه خشک شده و سپس در دمای 300، 400، 450 و 500 درجهٔ سلسیوس به مدت یک و نیم ساعت بازیخت شدند. طیف XRD در دمای 2°300 نشان می دهد که نمونه شکل بلوری نداشته و حالت آمور فی غالب است ولی طیف XRD برای نمونه هایی که در دما 400، 450 ولی طیف رای نمونه بدون آلایش Zno هستند و هر چه طیف برای نمونه بدون آلایش Zno هستند و هر چه دمای بازیخت افزایش می یابد شکل بلوری منظم تر می شود زیرا در این دما همهٔ مواد آلی در نمونه ها تبخیر شده و نمونه ها یکده تر می شوند.



شکل1.طیف XRD نمونه های Zno.95Mno.050 بازپخت شده در دماهای 300، 400، 450 و 500 درجه سلسیوس.

بررسی طیفهای XRD نمونهها نشان می دهد که آنها تک فاز بوده و دارای ساختار هگزاگونال (ورتسایت) میباشند. هیچگونه فاز ثانوی مطابق با ساختارهای اکسید منگنز و خوشههای مربوطه در طیف ها دیده نمی شود. افزایش پهنای طیفهای XRD در مقایسه با نمونهٔ بدون آلایش احتمالاً به دلیل حضور پنج درصدی منگنز در نمونه ها است. زیرا شعاع یونی Mn<sup>2+</sup> (0.83 A) است و (A کوچکتر از شعاع یونی Mn<sup>2+</sup> (0.83 A)

طبق قانون وگارد انتظار افزایش پارامتر شبکه در جهت محور C را داریم. به علت ویژگی های رشد بلور به روش سل - ژل، انتظار رشد دانه ها در جهت های مختلف (چند بلوری) را داریم. با مقایسهٔ شدت قله ها می توان نتیجه گرفت که دانه ها ترجیحاً در جهت 101 رشد می یابند. شکل 2 طیف XRD نمونهٔ پو دری Zno.95Mn0.05O را واقعییت است که پهنای قله ها تا حدودی کاهش یافته است و در ضمن شدت آن به دلیل بهبود کیفیت ساختار بلوری نمونه ها افزایش یافته است که مطابق با نتایج دیگران است [19].



شکل2 طیف XRD پودر Zn0.95Mn0.05O بازپخت شده در دمای 800 درجه سلسیوس.

شکل3 طیف نور تراگسیل نانوفیلمهای 2no.95Mno.05O در دمای اتاق به ازای دماهای بازپخت مختلف را نشان می دهد. شکل توافق خوبی بین دادههای تجربی و تئوری حاصل از روش چامبلیرون (PUMA) را نشان می دهد [9]. شفافیت هر یک از طیفها در ناحیهٔ مرئی حدود ٪80 است و با افزایش دمای بازپخت کاهش می یابد. با توجه به اینکه ساختار بلوری با افزایش دمای بازپخت بهبود می یابد این کاهش شفافیت احتمالاً به دلیل حضور اتم های منگنز در شبکهٔ بلوری می باشد [10].



**شکل3.** نمودار طیف تراگسیل تجربی و تئوری.

شکل4 تغییرات <sup>2</sup>(αhv) نمونهها را برحسب انرژی نشان میدهد که α ضریب جذب و hv انرژی فوتون ورودی است. برای محاسبهٔ گاف نواری مستقیم نمونه ها می توان از رابطهٔ

$$\left(\alpha h v\right)^2 = \left(h v - E_g\right) \tag{1}$$

بهروش برون یابی استفاده کرد. از نمودار می توان نتیجه گرفت که انرژی گاف Zno.95Mno.05O با تغییر دمای بازپخت بین 3/45 تا 3/84 الکترون ولت تغییر می کند. با افزایش دمای بازپخت گاف انرژی کاهش می یابد. چون گاف انرژی ساختار کپهای MnO در حدود چون گاف انرژی ساختار کپهای MnO در حدود پنچ درصدی منگنز در ZnO طبق قانون وگارد گاف انرژی افزایش یابد که شکل 4 این موضوع را به خوبی نشان می دهد [14].



**شکل4** گاف انرژی نانو فیلمها را در دماهای بازپخت مختلف نشان میدهد.

تعيين ثابتهاي اپتيكي همچون ضريب شكست و ضریب میرائی در لایههای نازک مسئلهٔ بسیار مهمی است که می توان بهروش تجربی یا بهروش تئوری آنها را تعیین کرد. در اینجا بهروش تئوری چامبلیرون و همکاران (PUMA) و با استفاده از برازش دادهها با رابطهٔ کوشی تغییرات آنها را برحسب طول موج نور محاسبه كردهايم. شكل5 و 6 نمودار تغيرات ضريب شکست و ضریب میرائی برحسب طول موج را نشان میدهد. برای تمام نمونهها ضریب شکست و ضریب میرائی در طول موجهای بزرگتر از حدود 450 نانومتر کاهش یافته ولی در طول موجهای کوچکتر از آن مقادیر بزرگی بهخود می گیرند (لبههای جذب). این شکل ها همچنین نشان میدهند که دمای بازیخت با ضريب شكست و ضريب ميرائي رابطهٔ مستقيم دارد یعنی هر چه دمای بازیخت بیشتر(کمتر) شود ضریب شکست و ضریب میرائی بزرگتر(کوچکتر) می شود.



**شکل 5.** نمودار تغییرات ضریب شکست را برحسب طول موج در دماهای بازیخت مختلف نشان می دهد.



**شکل 6.** نمودار تغییرات ضریب خاموشی بر حسب طول موج در دماهای بازیخت مختلف.

در این تحقیق نانوفیلمهای Zn<sub>0.95</sub>Mn<sub>0.05</sub>O با استفاده از روش سل -ژل رشد داده شدهاند. نتایج حاصل نشان میدهد که با افزایش دمای بازپخت طیف تراگسیل (شفافیت) و گاف انرژی نانوفیلمها کاهش مییابند در حالی که ضریب شکست و ضریب میرائی افزایش مییابند. طیف XRD در حالت نانوفیلم و در حالت پودری نمایانگر این واقعییت است که افزایش دمای بازپخت باعث بهبود ساختار بلوری می شود که احتمالاً بدلیل کاهش چگالی در رفتگیها میباشد [12].

## نقش الكل

برای بررسی اثرات نوع الکل حلال بر روی خواص اکسید روی آلاییده با منگنز Zn<sub>0.98</sub>Mn<sub>0.02</sub>O از چهار نوع الكل حلال، 2-متوكسي اتانول، 2-ايزوپروپانول، متانول و 1-بوتانول استفاده شده است. خواص شیمیایی و فیزیکی حلالها در جدول1 نشان داده شده است. محیط سل تقریباً قلیایی و مقدار آن با توجه به الكل حلال از 7/4 تا 7/83 تغيير مي كند [11]. در اين بررسی تغییرات وسکوزیته با تغییر حلال از 2/3 تا 4/8 متغیر است. برای تهیه نانو فیلمهای مورد مطالعه، ابتدا در دمای اتاق، استات روی و منگنز با نرخ اتمی  $Mn/_{Zm}=$ %2، در محلول حاوی حلال و پایدار ساز با نسبت  $[MEA]_{Zn^{+2}}$  حل مىشوند. MEA چهار محلول نهائی با همزن مغناطیسی بهمدت یک ساعت در دمای C<sup>0</sup>C همزده شدهاند تا در نهایت یک محلول یکنواخت حاصل گردد. برای جلوگیری از كاهش حجم حلال و پايدار ساز آن عمل رفلاكس صورت گرفته است تا غلظت محلول تغییر نکند. لایه نشانی در دمای اتاق و بعد از 24 ساعت بهروش غوطه ورسازی صورت گرفته است. زیرلایه های شیشهای مورد استفاده برای عملیات لایه نشانی ابتدا در آب جوش همراه با مواد شوینده بهمدت نیم ساعت جوشانده شده و یس از شستشوی مجدد با آب مقطر توسط ترکیب الکل و استون در حمام آلتراسونیک تا حد امکان تمیز گردیدند. سپس زیرلایه را در جایگاه مربوطه بهصورت عمودی گذاشته و با سرعت یک ميليمتر بر ثانيه أن را از سل خارج نمودهايم. نمونه لايه نشانی شده را سپس بهمدت بیست دقیقه توسط یک کوره الکتریکی در دمای اولیه 200°C حرارت دادهایم تا قسمتی از مواد آلی موجود در لایه تبخیر شده و عمل خشک سازی اولیه صورت پذیرد. عملیات لایه نشانی با روند اشاره شده پنج بار تکرار شد. در نهایت نانو فيلمهاي تهيه شده بهمنظور عمليات بازپخت نهائي، در

دمای500 درجه سلسیوس بهمدت یک و نیم ساعت

حرارت داده شدهاند.

نوع	نوع الكل	فرمول شيميائي	جرم مولی (g/mol)	شکل ظاہری	چگالی (g/cm³)	نقطه ذوب ( <sup>O</sup> C)	ضريب شكست	PH حلال
1	2-methoxyethanol	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	76 <sub>/</sub> 10		0,965	125	1/402	7
2	Isopropanol	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O	60,10	مايع شفاف	0/786	82/3	1/3776	7
3	Methanol	CH <sub>3</sub> OH	32,04	بی رنگ	0 <sub>/</sub> 7918	64/7	1,328	7
4	1-Butanol	$C_4H_{10}O$	174,12		0,8098	117 <sub>/</sub> 73	1,339	7

**جدول1.** پارامترهای فیزیکی و شیمیایی الکلهای استفاده شده در دمای 20 درجه سلسیوس.

شکل7 طیف XRD همهٔ نمونههای بازپخت شده در دمای اتاق را نشان میدهد.



**شكل7.** طيف XRD همهٔ نمونهها.

مشخصات ساختاری نمونهها در جدول2 آورده شده است. الگوی پراش نشان می دهد همه نمونهها فقط در جهت (002) ساختار بلوری تشکیل دادهاند. ساختار تمام فیلمها هگزاگونال است و هیچ گونه فاز ثانویه ناشی از تشکیل ساختار خوشهای منگنز یا اکسیدهای

آن دیده نمی شود. همانطور که از جدول2 دیده می شود تغییر نوع حلال، پهنای قله (FWHN) نمونه ها را تغییر می دهد که در نتیجه روی اندازه دانه ها و کیفیت نمونه ها تأثیر مستقیم می گذارد. پارامتر شبکه c افزایش می یابد که دلیل آن ممکن است تفاوت در شعاع یونی که دلیل آن ممکن است تفاوت در شعاع یونی باعث ایجاد کرنش در سلول واحد Zn<sup>2</sup> شده و احتمال باعث ایجاد کرنش در بعضی جهات تغییر دهد.عمل واهلش ابعاد که بلور برای تنش زدایی انجام می دهد، باعث تغییر پارامتر شبکه در جهت c می شود و این پارامتر را افزایش می دهد [12].

همانطور که در جدول نشان داده شده است، حلالها روی اندازهدانهها نیز تأثیر می گذارند. کوچکترین دانهها مربوط بهنمونه با حلال متانول می باشند. از این خصوصیت می توان در حسگرهای گازی اکسید روی بهره جست [13و14].

نوع الكل	ثابت شبکه (A <sup>0</sup> ) a=b C				FWHM <sup>0</sup>	مو قعیت قلهها	اندازهٔ دانهها
	حجمى	این کار	حجمى	این کار		(20)	(nm)
1					0,283	34,561	31,320
2	3 <sub>/</sub> 2495	3 <sub>/</sub> 24900	5,2069	5,20800	0/305	34 <sub>/</sub> 474	28 <sub>/</sub> 7868
3					0,441	34 <sub>/</sub> 476	19 <sub>/</sub> 9093
4					0 <sub>/</sub> 171	34 <sub>/</sub> 436	51 <sub>/</sub> 3396

جدول2. ویژگیهای ساختاری XRD همهٔ نمونهها.

طیف تراگسیل ثبت شدهٔ نمونه ها در دمای اتاق در دو دمای خشک سازی 200<sup>0</sup>C و دمای بازپخت 500<sup>0</sup>C در شکل8 و 9 نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود در ناحیهٔ مرئی همهٔ نمونه ها شفاف هستند و لبه جذب حدود 300 نانومتر است. طیف تراگسیل نمونه های بازپخت شده در ناحیهٔ مرئی تا طول موج حدود 400 نانومتر افزایش یافته و سپس تقریباً ثابت می شود ولی در ناحیهٔ فرابنش طیف بعضی نمونه ها مقدار کمی کاهش می یابد.



**شکل8.** طیف تراگسیل ثبت شده نمونهها در دمای اتاق در دمای خشک سازی C<sup>0</sup> 2000.

درصد طیف تراگسیل نمونهٔ تهیه شده با حلال 3 برای تمام طول موجها بالاتر از سایر نمونههاست و دارای

ماکزیمم 90 درصد می باشد. طیف تراگسیل نمونههای بازپخت شدهٔ شکل9 در مقایسه با شکل8 کاهش اندکی را نشان میدهد اما هنوز نمونهٔ تهیه شده با حلال3دارای طيف تراگسل بالاتري نسبت به همهٔ نمونهها ميباشد. در برخورد نور به نیمرسانا سه پدیدهٔ جذب، انتقال و انعکاس روی میدهد. در انعکاس از یک فیلم نازک، نور نه تنها از سطح خارجی منعکس میشود بلکه از فصل مشتركها نيز انعكاس مي يابد. ضريب شكست اکسید روی خیلی بیشتر از ضریب شکست هوا و شیشه است، بنابراین انعکاس کلی از فصل مشترکها نیز اتفاق میافتد. این اثر علاوه بر کاهش طیف تراگسیل، بهعلت اختلاف فاز ايجاد شده منجر بهتشكيل يك الكوى تداخلی نیز می گردد. افت و خیزهای ضعیف مشاهده شده در شکل2 ناشی از این اثر میباشد. در لایههای بازپخت شده این افت و خیزها در طیف تراگسیل کاهش مییابند که احتمالاً ناشی از اثرات بازپخت روی كيفيت فصل مشتر كهاست [12].



mکل9.طیف تراگسیل ثبت شده در دمای اتاق در دمای بازپخت  $500^{0}$ C.

گاف انرژی با استفاده از رابطهٔ محاسبه شده است شکل 10، <sup>2</sup>(αhv) برحسب انرژی نور فرودی را برای نمونههای بازپخت شده نشان می دهد. طبق نتایج به دست آمده نمونهٔ تهیه شده با حلال 3 (متانول) دارای بزرگترین انرژی گاف eV (3/2648) و نمونه تهیه شده با حلال 4 کوچکترین مقدار انرژی گاف برابر ev با حلال 4 کوچکترین مقدار انرژی گاف برابر ev گاف با اندازهٔ دانهها رابطهٔ عکس دارد. دمای خشک سازی و دمای بازپخت اثرات مهمی بر خواص سازی و اندازهٔ ساختاری و اپتیکی لایههای نازک In In 200 درجه دانهها دارند [16–11] بازپخت در دمای 500 درجه سلسیوس، باعث تبخیر مواد آلی شده و در نتیجه موجب تشکیل ساختار بلوری ZnO می شود.



**شکل10.** گاف نواری مستقیم نمونههای باز پخت شده برای حلالهای مختلف.

ثابتهای اپتیکی با استفاده از روابط پوما محاسبه شده سپس با روابط کوشی برازش شدهاند. وابستگی ضریب شکست نمونهها بهطولموج در شکل11 نشان داده شده است. ضریب شکست نمونهٔ 4 بهطور سریع با افزایش طولموج، کاهش مییابد و سپس تقریباً در طولموج 400 نانومتر ثابت میماند. ضریب شکست نمونههای 3و 4 با وجود داشتن رفتار اولیه متفاوت در طولموجهای بیشتر از 500 نانومتر تقریباً رفتار مشابهی دارند. نمونههای 1و 2 با افزایش طول موج، کاهش پیدا میکنند.

محمد يونسي و مهرانه نعمتي



**شکل11.** تغییرات ضریب شکست برای نمونهها برحسب طول موج با استفاده از حلالهای مختلف.

ضریب خاموشی در شکل12 نشان داده شده است. ضریب خاموشی نمونههای1و2 برای طولموجهای کمتر از 450 نانومتر شدیداً وابسته بهطولموجهای ورودی است اما بعد از آن تقریباً ثابت است. ضریب خاموشی نمونههای3و4 برای طولموجهای کمتر از حدود600 نانومتر وابسته بهطولموج است ولی برای طولموجهای بلندتر نه تنها ثابت است بلکه همچنین از نمونههای1و2 کمتر می باشد. خواص اپتیکی نمونههای 1و2 تقریباً یکسان و مستقل از نوع حلال می باشد [13]. 180



**شکل12.** تغییرات ضریب خاموشی برای نمونهها برحسب طولموج با استفاده از حلالهای مختلف.



**شکل13.** عمق نفوذ برحسب طول موج فرودی برای نمونهها.

در شکل13 عمق نفوذ نمونه ها برحسب طول موج نور فرودی نشان داده شده است. عمق نفوذ همهٔ نمونه ها در نزدیکی لبهٔ جذب تقریباً صفر است زیرا نور فرودی در این طول موجها جذب می شود. عمق نفوذ نمونه های 4-1 برای طول موجهای بلند تقریباً یکسان است ولی برای طول موجهای کمتر از تقریباً 600nm اختلاف قابل توجه ای وجود دارد.

بنابراین در این کار با استفاده از روش سلژل و با انتخاب حلالهای مختلف، 2-میتوکسی اتانول، 2-ایزوپروپانول، متانول و 1-بوتان، لایهٔهای نازک Zn0.98Mn0.02O رشد داده شدهاند. خواص ساختاری

و نوری این نمونه ا توسط اشعهٔ x و طیف تراگسیل اندازه گیری شده است. ثوابت نوری با استفاده از روابط چامبلیرون و برازش آن با روابط کوشی برای لایه های نازک محاسبه گردید. این نتایج نشان می دهد نمونه ای که با حلال3 تهیه شده است دارای طیف تراگسیل بالاتری در همهٔ بازه های طول موج می باشد و حداکثر طیف تراگسیل آن در حدود 90 درصد است. طیف گسیلی همهٔ نمونه ها در حدود ده درصد به نوع حلال وابسته است. نتایج محاسبه گاف نواری نشان داد که نمونه های آماده شده با حلال 4-1 تقریباً گاف انرژی یکسانی 3/6eV (5/5) دارند و با تغییر نوع حلال یک اختلاف در حدود 100m در انرژی گاف ایجاد می شود [11].

### نقش لايه

نمونههای ZnO:Mn مطالعه شده در این مقاله بهروش سل-ژل رشد داده شدهاند. در این روش برای تهیهٔ نانو فیلمهای مورد نظر ابتدا در دمای اتاق، استات روی و منگنز را با نرخ اتمی  $_{36} = \frac{[Mn]}{[Zn]}$ ، در محلول MEA و MEA با نسبت  $_{1} = \frac{[MEA]}{[Zn^{+2}]}$  حل نمودیم.

محلول نهائی با همزن مغناطیسی در دمای 2°08 بهمدت یک ساعت همزده می شود، که در نهایت یک محلول یکنواخت و شفاف حاصل می گردد. در دمای اتاق، بعد از 24 ساعت به روش غوطه ورسازی عمل لایه گذاری صورت می گیرد. پس از انجام عملیات تمیز کاری زیر لایه های شیشه ای، آنها را در جایگاه مربوطه میلیمتر بر ثانیه زیرلایه را از سل خارج کرده و به مدت بیست دقیقه آن را در یک کوره با دمای اولیهٔ 2°200 حرارت می دهیم تا قسمتی از مواد آلی محلول در زیرلایه تبخیر شوند. بدین ترتیب عمل خشک سازی اولیه صورت می گیرد. عملیات لایه گذاری را برای دو محمد يونسي و مهرانه نعمتي

نمونه یکی با سه بار و دیگری با پنج بار تکرار انجام دادیم. در نهایت نانو فیلمهای تهیه شده را برای عملیات بازپخت نهائی در دمای 500 درجهٔ سلسیوس در کوره در هوای آزاد بهمدت یک و نیم ساعت حرارت دادیم. سپس نانو فیلمها را برای انجام آزمایش های فیزیکی تا دمای اتاق بهطور طبیعی سرد کردیم. PH متری محیطی نشان مىدهد كه محيط سلى تقريباً قليائى(7/6) با ويسكوزيته 3/1 mPa.s است.

شکل14 طیف نور تراگسیل نانو فیلمهای سه و پنچ لایهٔ را در دمای اتاق بهازای دمای Zn<sub>0.97</sub>Mn<sub>0.03</sub>O خشكسازى اولية C° 200 نشان مىدهد. اين شكل بەخوبى نشان مىدھد طيف تراگسيل مربوط بەلاية با ضخامت بزرگتر کاهش بیشتری می یابد. دلیل این کاهش می تواند بهدلیل افزایش ضخامت نور عبوری از ماده و در نتیجه برهمکنش بیشتر با آن باشد. این برهم کنش به شکل پراکندگی از اتمها یا حامل های بار(الكترون/حفره)، انعكاس و جذب ظاهر شده و شدت نور ورودی را کاهش میدهد و انتظار کاهش طيف تراگسيل را داريم. فاکتور ديگري که باعث کاهش طيف مىشود حضور ناخالصى Mn است. أزمايشات ما نشان میدهد که هرچه در صد منگنز بیشتر باشد بهعلت كدر شدن نمونه ها طيف تر اگسيل كاهش مي يابد .[11]



**شکل14.** نمودار طیف تراگسیل تجربی در دمای خشک سازی اولیهٔ C° .200

طیف نور تراگسیل در دمای اتاق برای نمونههای رشد داده شده، بهازای دما خشک سازی نهائی C° 500، در شکل 15 نشان داده شده است. همان طور که در شکل ها ديده مىشود تغيير شفافيت بهدليل اثر افزايش ضخامت ممکن است بهاین دلیل باشد که سطوح لایهنشانی در این وضعیت با هم موازی نبوده و بهدلیل انعکاسهای داخلی و تشکیل نوارهای تداخلی شفافیت کاهش یابد. بهعلت تشکیل ساختار بلوری در دمای بازیخت C<sup>o</sup>C و نیز تبخیر بیشتر مواد آلی انتظار داریم شفافیت اندکی کاهش یابد. مقایسهٔ شکلهای14 و 15 این امر را نشان میدهد. تراگسیل کلی نمونههای تهیه شده در دمای 500°C در طولموجهای پایین تر از حدود 450 نانومتر كاهش مى يابد. اما طيف تراگسيل آن بهازاى طول موجهای بالاتر از حدود 700 نانومتر بهطور محسوسی افزایش می یابد که بررسی علت آن نیازمند مطالعات بیشتری است. با استفاده از روش چامبلیرون و همکاران [9] طيف تراگسيل نمونهها برحسب طول موج را محاسبه که نتایج آن را در شکل15 رسم شده است که توافق خوبی با دادههای تجربی دارد.



شکل15. نمودار طیف نراگسیل تجربی و تئوری نمونه ها در دمای خشک سازی نهائی C<sup>o</sup> 500.

شکل16 تغییرات  $(lpha h v)^2$  نمونهها در دمای خشک سازی نهائی C° 500 را برحسب انرژی نشان میدهد که a ضریب جذب و hv انرژی فوتون ورودی است. دلیل باشد که برهم کنش نور با الکترونها و اتمهای ماده بیشتر (کمتر) می شود [11].



شکل17. نمودار تغییرات ضریب شکست تئوری و برازشی نانو فیلمهای بازپخت شده Zn<sub>0.97</sub>Mn<sub>0.03</sub>O برای نمونههایی با سه و پنج لایه.



**شکل18.** نمودار تغییرات ضریب خاموشی تئوری و برازشی نانو فیلمهای بازپخت شده Zn<sub>0.97</sub>Mn<sub>0.03</sub> برای نمونههایی با سه و پنج لایه.

در این تحقیق دو نوع نانو فیلم ZnO:Mn ، با ضخامتهای مختلف در دماهای باز پخت 2°200 و C<sup>0</sup>00 بهروش سل-ژل بهطور موفقیتآمیزی رشد داده شدهاند. طیف تراگسیل نمونه ها اندازه گیری شدند. با استفاده از طیف سنجی اپتیکی و روابط چامبلیرون، ثوابت اپتیکی را محاسبه کردیم. از مجموعه کارهای انجام شده بهروش تجربی و تئوری می توان نتیجه برای محاسبهٔ گاف نواری مستقیم نمونهها می توان از رابطهٔ ۱ بهروش برونیابی استفاده کرد. از نمودار می توان نتیجه گرفت که انرژی گاف Ro.07Mn.030 با تغییرات ضخامت از مقدار 3/38 الکترون ولت بهمقدار 3/41 الکترون ولت تغییر می کند. با افزایش ضخامت گاف انرژی افزایش می یابد. چون گاف انرژی ساختار کپهای MnO در حدود 2/44 است [6]، بنابراین انتظار می رود که با آلایش منگنز در ZnO طبق قانون وگارد گاف انرژی افزایش یابد که این تغییرات برای هر دو نمونه یکسان است. هرچه ضخامت نمونهها کم (زیاد) باشد پتانسیل در رفتگی ناشی از کرنش و فشار بر روی اتمها زیاد(کم) بوده که نتیجه آن به شکل کاهش (افزایش) انرژی گاف نواری ماده ظاهر می شود.



**شکل16.**محاسبهٔ انرژی گاف نانوفیلمها Zn<sub>0.97</sub>Mn<sub>0.03</sub>O در دمای خشک سازی نهائی ℃ 500.

شکلهای 17 و 18 تغییرات ضریب شکست و ضریب خاموشی بر حسب طول موج نمونه های سه و پنجلایه ای را نشان می دهند. در هر دو نمونه ضریب شکست و ضریب خاموشی در طول موج های بزرگتر از 450 نانومتر ابتدا مقداری کاهش و سپس تقریباً ثابت است ولی در طول موج های کو چکتر از آن مقادیر بزرگی به خود می گیرند. مطابق این نمودارها هر چه ضخامت نانوفیلم ها بیشتر (کمتر) شود ضریب شکست و ضریب خاموشی بزرگتر (کو چکتر) می شود که می تواند به این محمد يونسي و مهرانه نعمتي

گرفت که هرچه دمای باز پخت و ضخامت نمونهها افزایش یابد ساختار بلوری لایهها بهبود یافته و باعث افزایش ثوابت اپتیکی و گاف انرژی ماده میشود و طیف تراگسیل اندکی کاهش مییابد [11].

## بحث و نتیجه گیری

در این بررسی با استفاده از روش سل-ژل نانو فیلمهای اکسید روی آلاییده با منگنز ZnO:Mn در ضخامت های مختلف و با دماهای باز یخت مختلف تهیه شد. نتایج نشان میدهند با افزایش دمای باز پخت طيف تراگسيل و گاف انرژی نانو فيلمها کاهش می یابند، در حالی که ضریب شکست و ضریب خاموشی افزایش می یابند. با افزایش دمای باز یخت و ضخامت نمونهها، كيفيت بلوري موجب افزايش ثابتهاي اثر حلالهای مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت. خواص ساختاری و اپتیکی نمونهها با یرتو اشعهٔx و طیف تراگسیل اندازهگیری شد. ثابتهای اپتیکی با روابط پوما و برازش آن با روابط کوشی محاسبه گردید. نتایج نشان می دهند نمونهٔ تهیه شده با حلال متانول در همهٔ بازههای طول موج درصد تراگسیل بالاتری دارند. حداکثر طیف تراگسیل برای این حلال حدود 90% مي باشد. همچنين نمونهٔ تهيه شده با حلال متانول بزرگترین گاف انرژی (3/2648) و کو چکترین اندازهٔ دانه (19/9093) و حلال4، كوچكترين گاف انرژى (3/2194) و بزرگترین اندازهٔ دانه (51/3396) را دارا می باشند. اکسید روی در حسگرهای مغناطیسی، دمایی و گازی مورد استفاده قرار می گیرند. در حسگرهای گازی با کاهش اندازهدانههای اکسید روی، پاسخ حسگر افزایش می یابد، بنابراین مطابق نتایج بهدست آمده از آزمایشات ما استفاده از حلال متانول موجب بهبود پاسخ حسگرهای گازی مبتنی بر اکسیدروی خواهد شد.

بهخاطر نظرات و مساعدتهای علمی، همچنین از مسئول آزمایشگاه رشد بلور دانشگاه صنعتی شاهرود جناب آقای رضا مسکنی بهخاطر ثبت سفارش و تهیهٔ مواد مورد نیاز و از جناب آقای آرش پاکدل بهخاطر همکاری در رشد و تهیهٔ نمونهها کمال قدردانی و تشکر را داریم.

لازم مي دانم كه از آقايان دكتر قدسي، قاضي و ايزدي

مرجعها

[1] ع.م. قلمبر دزفولی، ح. گودرزی، ز. صیدالی لیر، ساخت نانومیلههای هسته/پوسته ZnO/ZnS بهروش آبی -حرارتی و بررسی خواص ساختاری و نوری آنها، مجلهٔ پژوهش سیستمهای بس ذرمای 8 (1397)، 181-171.

[1] A.M. Ghalambor Dezfouli, H. Goudarzi, Z. Seidali lir, Fabrication of core-shell ZnO/ZnS nanorods by hydrothermal method and study of their structural and optical properties, *Journal of Research on Many-body Systems* **8** (2018) 171-181.

[2] D.R. Lide (Ed.), *CRC Handbook of Chemistry and Physics*, CRC Press, **73**rd Edition, New York (1992).

[3] J. Jaffe, A.J. Snyder, Z. Lin, A.C. Hess, LDA and GGA calculations for high-pressure phase transitions in ZnO and MgO, *Physical Review B* 62 (2000) 1660.

[4] H.M. Cheng, K.F. Lin, H.C. Hsu, W.F. Hsieh, Size dependence of photoluminescence and resonant Raman scattering from ZnO quantum dots, *Applied physics letters* **88** 26 (2006) 261909.

[5] C. Sommer, P. Krüger, J. Pollmann, Optical spectra of alkali-metal fluorides, *Physics Review B* 86 (2012) 155212.

[6] M. Futsuhara, K. Yoshioka, O. Takai, Optical properties of zinc oxynitride thin films, *Thin Solid Films 317* (1998) 322.

[7] A.V. Fonoberov, A.K. Alim, A.A. Balandin, Photoluminescence investigation of the carrier recombination processes in ZnO quantum dots

سپاس گزاری

[17] Y.S. Kim, W.P. Tai, S.J. Shu, Effect of preheating temperature on structural and optical properties of ZnO thin films by sol–gel process, *Thin Solid Films* 491 (2005) 153 – 160.

[18] S.W. Xue, X.T. Zu, W.L. Zhou, H.X. Deng, X. Xiang, L. Zhang, H. Dengd, Effects of post-thermal annealing on the optical constants of ZnO thin film, *Journal of Alloys and Compounds* 448 (2008) 21–26.

[19] Chemistry Standard Reference Materials Portal: www.nist.gov/chem-srm-portal.

and nanocrystals, *Physical Review 73* (2006) 165317.

[8] R. Ghosh, GK. Paul, D. Basak, Effect of thermal annealing treatment on structural, electrical and optical properties of transparent sol-gel ZnO thin films, *Materials Research Bulletin* 40 (2005) 1905-1914.

[9] E.G. Birgin, I. Chambouleyron, J.M. Martinez, Estimation of the optical constants films using unconstrained optimization, *Journal of Computational Physics 151* (1999) 862-880.

[10] R. Viswanath, S. Sapra, S.S. Gupta, B. Satpati, P.V. Satyam, B.N. Dev, D.D. Sarma, Synthesis and Characterization of Mn-Doped ZnO Nanocrystals, *Journal Physical. Chemestery B 108* (2004) 6303.

[11] M. Yuonesi, M. Izadifard, M.E. Ghazi, F.E. Ghodsi, Structural and optical properties of Zn<sub>0.98</sub>Mn<sub>0:02</sub>O thin films synthesized by the solgel technique and different kinds of solvent, *Chinese Journal of Physics 49* (2011) 941-949.

[12] M. Nemati, M. Yuonesi, Influence of Transition Elements Dopants on Physical Properties of Zinc Oxide Nanofilms, *Iranian Journal of Science and Technology* https://doi.org/10.1007/s40995-018-0579-8, (2018).

[13] Q. Qi, T. Zhang, S. Wang, X. Zheng, Humidity sensing properties of KC1-doped ZnO nanofibers with super-rapid response and recovery, *Sensors and Actuators B* 2 (2009) 649-655.

[14] A.R. Nimbalkar, M.G. Patil, Synthesis of ZnO thin film by sol-gel spin coating technique for H2S gas sensing application, *Physica B: Condensed Matter* 527 (2017) 7-15

[15] S. Fairose, S. Ernest, Nanostructured *ZnO* sensor fabricated by successive ionic layer adsorption and reaction method for ammonia sensing application, *Physica B: Condensed Matter 557*(2019) 63-73.

[16] M. Wang, J. Wang, W. Chen, Y. Cui, L. Wang, Effect of preheating and annealing temperatures on quality characteristics of ZnO thin film prepared by sol–gel method, *Materials Chemistry and Physics* 97 (2006) 219–225.

185